

第203回 (2)-1

群馬大学アナログ集積回路研究会-青木

RFアナログ集積回路のためのMOSFETモデリング技術

概要

本講演では、主にアナログ回路設計研究関連の大学院生を対象に、SPICE用MOSFETコンパクトモデルの解説とその効果的な使用方法について紹介します。最初に基礎的なMOSFETデバイスの物性とそのモデル化を解説し、徐々に先端的なモデリングの内容に入っていきます。最後にはDFM(製造を考慮した回路設計)に重要な統計モデリングについても紹介します。なお聴講者の理解度、希望によりその後お話しする対象デバイスを選択していきます。

アナログ回路設計者にとってシミュレーション精度は大変重要で、特に非線形デバイスのモデリング精度が支配的なため、できるだけ実際のアナログ回路シミュレーションで役立つ内容にしたいと考えています。

1. MOSFETの物性とモデル化の基礎
2. ~~回路設計者が使用するMOSFETコンパクトモデルの種類と特長(岡部先生が話されたと思うので中止)~~
3. RFアナログCMOSモデリング技術
4. 高耐圧MOSFETのモデル(オプション)
5. Nanometer CMOSモデリング紹介
6. 低電圧駆動回路設計のためのMOSFETモデル開発(オプション)
7. RF対応CMOS統計解析モデリング(オプション)

3

SLIDE 3

MOSFETの物性とモデル化の基礎

- デバイス・モデルとは
- SPICEモデルの種類
- モデル作成の流れ
- 半経験的なモデルの要素
- モデル式の導出
- MOSFETの基本物理モデル
 - ドレイン電流
 - 容量
 - ノイズ
 - 等価回路のY-Matrix化
 - MOSFETの複素Y-Matrix?

4

SLIDE 4

1. MOSFETの物性とモデル化の基礎

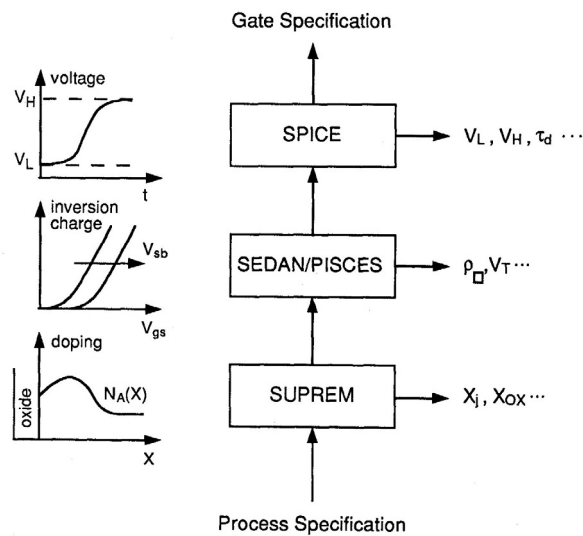
青木 均

SLIDE 5

デバイス・モデルとは

- デバイス・シミュレータのモデル

- 回路シミュレータSPICEのデバイス・モデル(コンパクト・モデル)



7

SLIDE 7

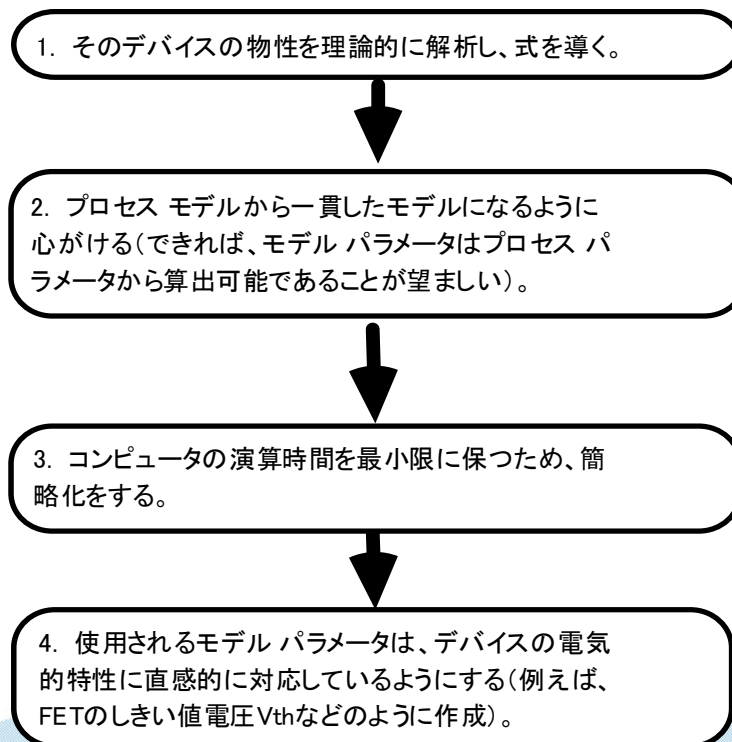
SPICEモデルの種類

- 物理的なモデル
- 経験的なモデル
- **半経験的な解析モデル**
- CADモデル(ファンクションモデル)
- マクロモデル
- Table-lookupモデル(表参照型)

8

SLIDE 8

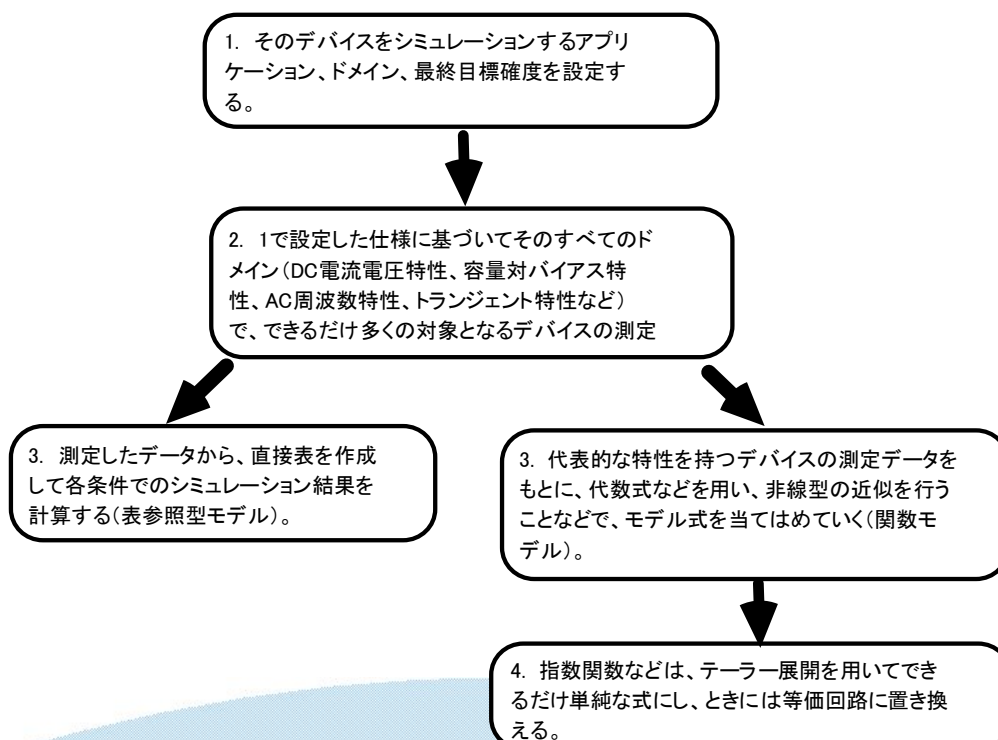
モデル作成の流れ(物理的モデル)



9

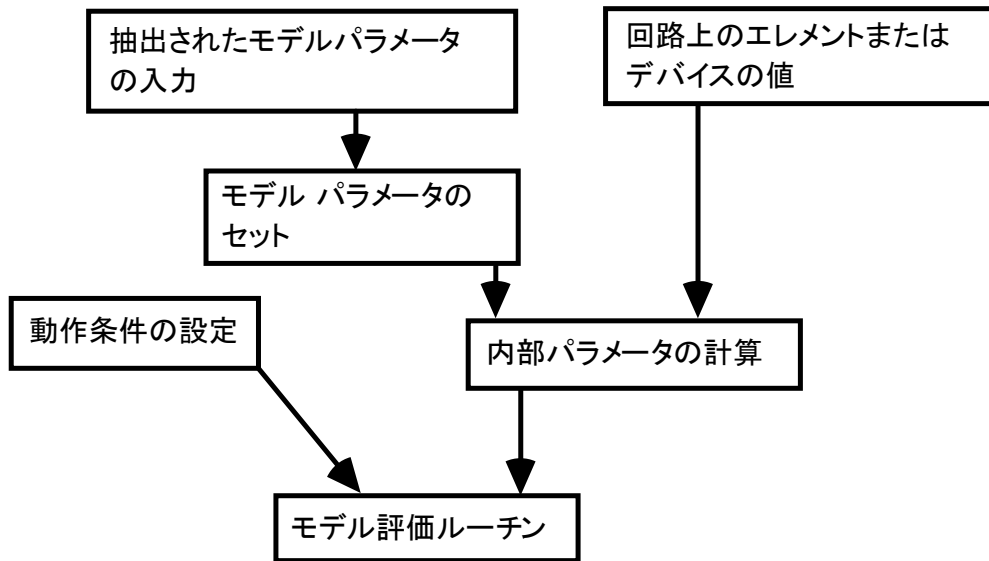
SLIDE 9

モデル作成の流れ(経験的モデル)



10

SLIDE 10



11

SLIDE 11

半経験的なモデルの要素

- **物理式に基づいた方程式**
 - 指数項、対数項が少ない
 - 微分方程式は境界条件を与える必要あり
 - 不連続点が出にくい
- **等価回路のY-Matrix**
 - どのデバイス・ノードを基準に作成するか
 - 対称型の方が収束有利
- (データベース・モデルは、回路設計用途のみに可能)

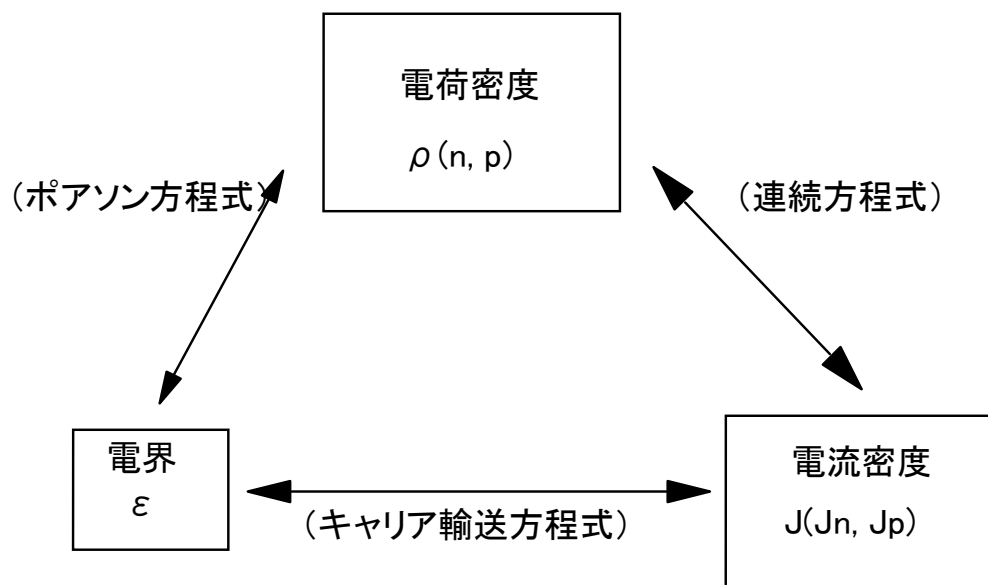
12

SLIDE 12

- デバイス構造、物性などから物理式を導出
- 多くのプロセスデバイスの測定データを元に、二次効果などを加える(不確定項はモデル・パラメータとする)
- シミュレーション確度にあまり影響しない、方程式の項を定数化
- 関数を簡略化(Polynomial近似、テーラー展開など)
- モデルパラメータを、測定データから抽出・最適化してシミュレーション結果を測定と比較

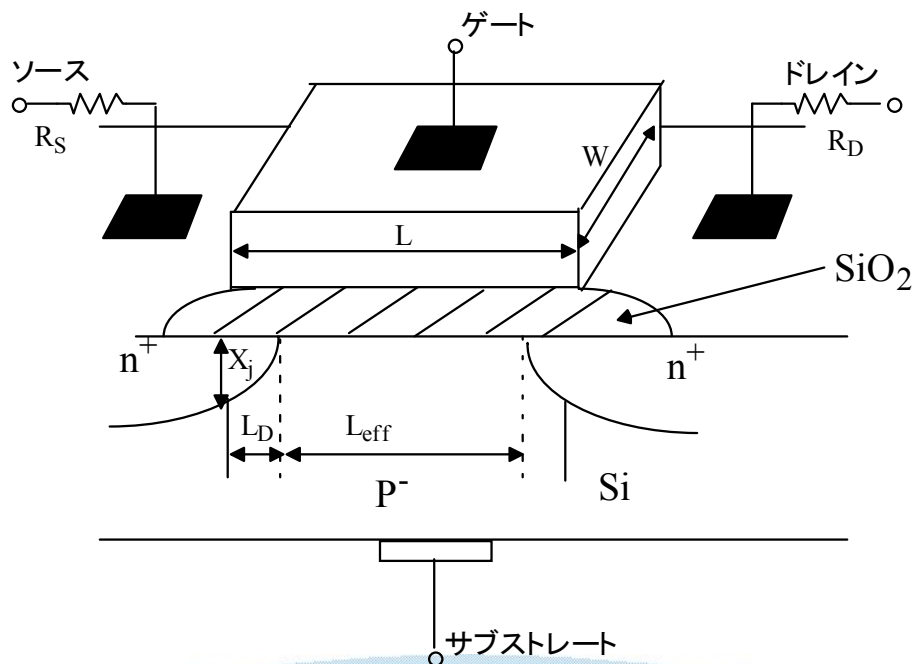
13

SLIDE 13



14

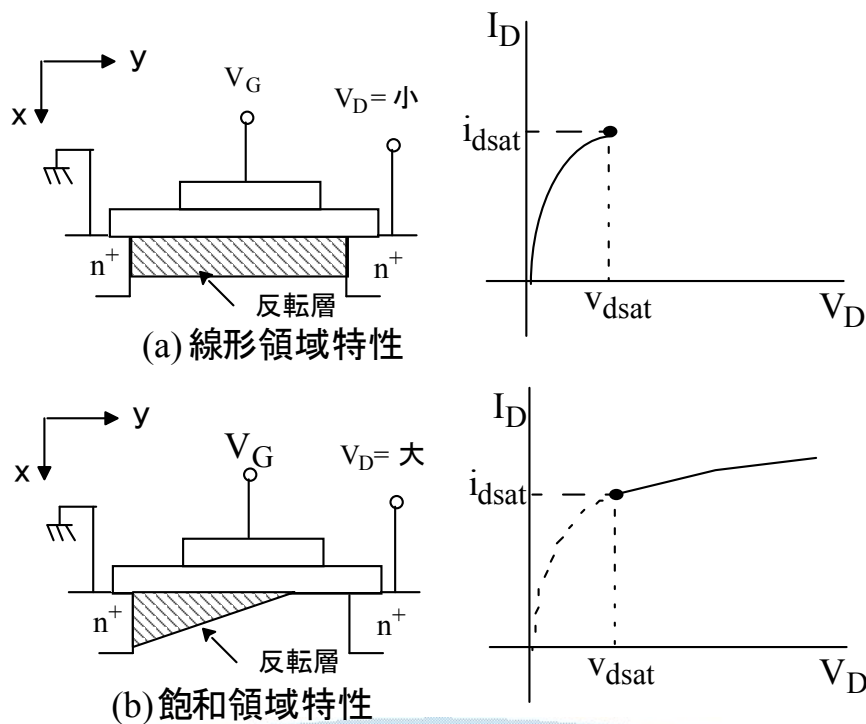
SLIDE 14



15

SLIDE 15

MOSFETの2つの領域動作



16

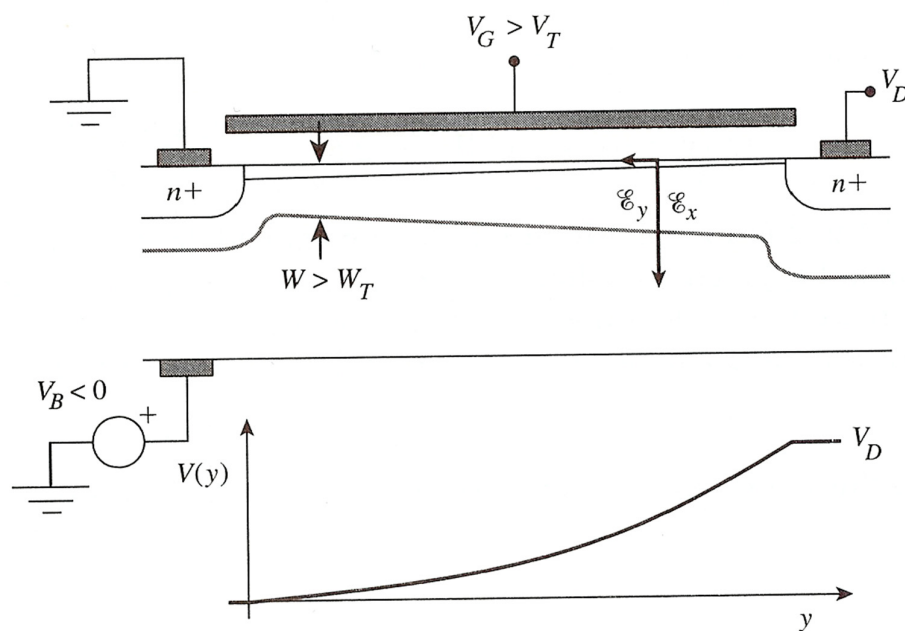
SLIDE 16

- 長チャネル ($L_{mask} > 10\mu\text{m}$)
- 電流密度方程式による解法

17

SLIDE 17

NチャネルMOSFETのチャネルピンチオフ状態での断面図



18

SLIDE 18

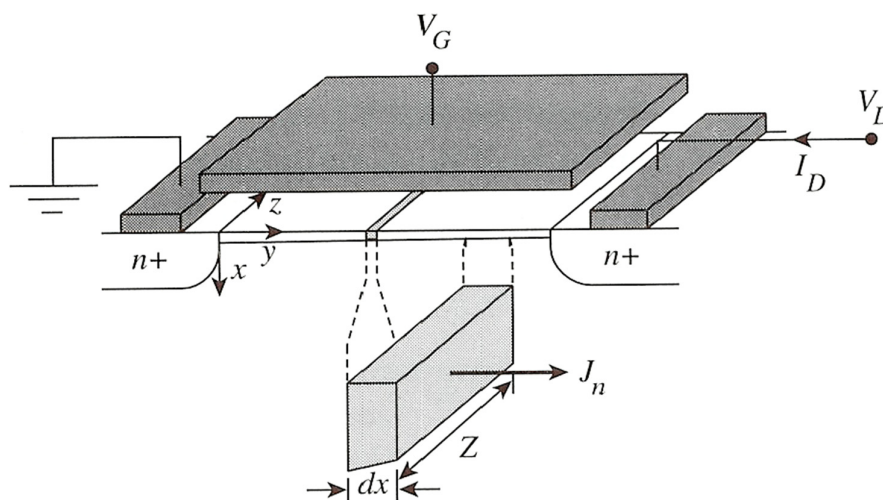
チャネルが十分に長い
場合, $\xi_x \gg \xi_y$

チャネル長方向の微小部分 dx に着目してみる. チャネル内の電子密度を $n(x, y)$ とすると
ドリフトによる電流密度は以下のように与えられる.

$$J_n = q\mu_n n(x, y)\xi = -q\mu_n n(x, y)\frac{dV}{dy}$$

ドレイン電流を J_n についてチャネルの境界面積で積分すれば,

$$I_D = -\int_0^Z dz \int_0^W J_n dx$$



ドレイン電流密度からの電流導出

積分はチャンネルZの幅と、空乏領域の厚さに対して行っている。

$$I_D = -Z \frac{dV}{dy} \int_0^W [-q\mu_n n(x, y)] dx$$

μ_n は局部ドーピング濃度、電子密度とその他の効果(後で様々なモデルにおいて逐次解説していく)によって表される。これらの効果を1つの変数実行移動度 μ_{neff} でまとめてみる。すると以下ようになる。

$$I_D = -Z \mu_{neff} \frac{dV}{dy} \int_0^W [-qn(x, y)] dx = -Z \mu_{neff} \frac{dV}{dy} Q_n(y)$$

21

SLIDE 21

チャンネル電荷とドレイン電流

両辺をチャンネルの全長で積分してみる。すると、

$$\int_0^L I_D dy = -Z \mu_{neff} \int_0^L \frac{dV}{dy} Q_n(y) dy$$

電流は全チャンネル長さ方向に一定でなくてはならないので、

$$I_D = -\frac{Z}{L} \mu_{neff} \int_0^{V_D} Q_n(V) dV$$

ここで $Q_n(y)$ は、チャンネルに沿った方向の反転層における電荷であった。
 $Q_n(y)$ に、表面空乏層における電荷 $Q_{sc}(y)$ を考慮して表すと以下ようになる。

$$Q_n(y) = -C_{ox}(V_G - V_T - \phi) - Q_{sc}(y)$$

$Q_{sc}(y)$ はポアソン方程式を用いて解くが複雑なので省略すると、

$$Q_{sc}(y) = -q \cdot N_a \cdot W_{\max} = -\sqrt{2\epsilon_s \cdot q \cdot N_a [V(y) + 2\phi_B]}$$

22

SLIDE 22

整理すると,

$$I_{DS} = \frac{W}{L} \cdot \mu_n \cdot C_{ox} \left\{ \left[V_G - V_T - \frac{V_D}{2} \right] V_D - \frac{2}{3} \frac{\sqrt{2 \cdot \epsilon_s \cdot q \cdot N_a}}{C_{ox}} \left[(V_D + 2\phi_B)^{\frac{3}{2}} - (2\phi_B)^{\frac{3}{2}} \right] \right\}$$

実効チャンネル長 L は,

$$L = L_O - 2 \cdot L_D$$

実効チャンネル幅 W は,

$$W = W_O - 2 \cdot W_D$$

ここで L_D , W_D はそれぞれチャンネルの拡散長・幅, L_O , W_O はそれぞれマスク長・幅を示す. さらに基板にも電圧 V_{BS} がかけられると, 基板の電位も変化するので,

$$I_{DS} = \frac{W}{L} \cdot \mu_n \cdot C_{ox} \cdot \left\{ \left[V_{GS} - V_T - \frac{V_{DS}}{2} \right] V_{DS} - \frac{2}{3} \frac{\sqrt{2 \cdot \epsilon_s \cdot q \cdot N_a}}{C_{ox}} \left[(V_{DS} + 2\phi_B - V_{BS})^{\frac{3}{2}} - (2\phi_B - V_{BS})^{\frac{3}{2}} \right] \right\}$$

23

SLIDE 23

飽和領域ドレイン電流式

(2.24)

飽和領域では, $X=L'$ のドレイン端での電荷は大体ゼロである. つまり,

$$Q_n(L') = (V_{GS} - V_{DSAT} - 2\phi_B - V_{FB})C_{ox} - \gamma \cdot C_{ox} \sqrt{V_{DSAT} - V_{BS} + 2\phi_B} \doteq 0$$

これを V_{DSAT} について整理すると,

$$V_{DSAT} = V_{GS} - V_{FB} - 2\phi_B + \gamma^2 \left[1 - \sqrt{1 + \frac{2}{\gamma^2} (V_{GS} - V_{FB} - V_{BS})} \right]$$

チャンネル長変調によって L は ΔL だけ短くなるので,

$$\frac{W}{L - \Delta L} = \frac{W}{L \cdot (1 - \lambda \cdot V_{DS})} \quad \lambda = \frac{\Delta L}{L \cdot V_{DS}}$$

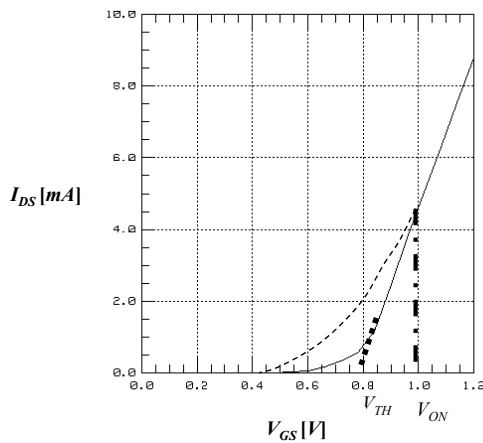
飽和領域のドレイン電流は,

$$I_{DS} = I_{DSAT} \frac{1}{1 - \lambda V_{DS}}$$

24

SLIDE 24

弱反転領域でのドレイン電流



$$V_{ON} = V_T + \frac{nkT}{q}$$

$$n = 1 + \frac{C_{FS}}{C_{ox}} + \frac{C_D}{C_{ox}}$$

$$C_{FS} = q \times N_{FS}$$

$$C_D = \frac{\partial Q_B}{\partial V_{BS}}$$

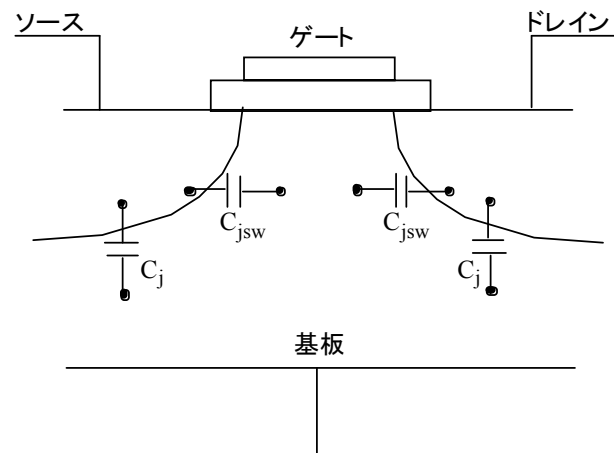
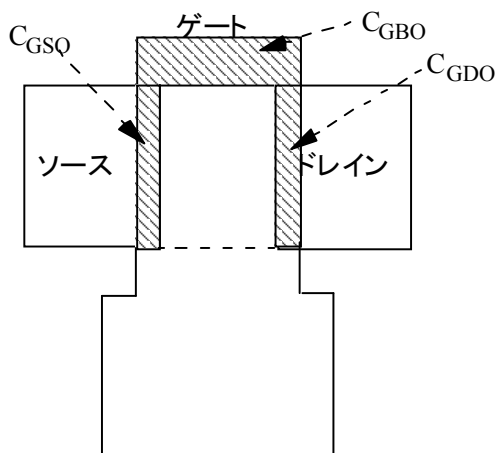
N_{FS} は物理的な意味はなく、フィッティング・パラメータである。
弱反転領域での電流式は、 $V_{GS} < V_{ON}$ の条件下で、

$$I_{DS} = \mu_s \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} \left\{ \left(V_{ON} - V_T - \frac{\eta V_{DS}}{2} \right) \cdot V_{DS} - \frac{2}{3} \gamma_s \left[(2\phi_B - V_{BS} + V_{DS})^{\frac{3}{2}} - (2\phi_B - V_{BS})^{\frac{3}{2}} \right] \right\} \times e^{\frac{q}{nkT} (V_{GS} - V_{ON})}$$

25

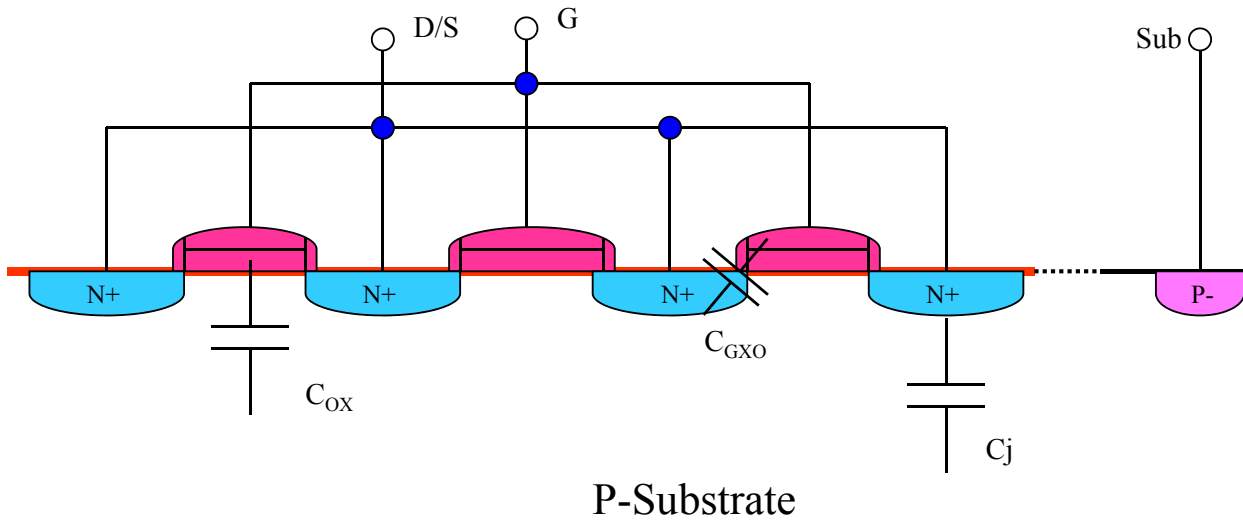
SLIDE 25

MOSFETの容量



26

SLIDE 26



27

SLIDE 27

アクティブなゲート容量

チャネル電荷は電荷保存則より

$$Q_c = -(Q_G + Q_B) \quad \text{または} \quad Q_c = Q_S + Q_D \quad Q_B = -Q_G$$

として表せる. 反転層の電荷を Q_n とすると, Q_S と Q_D はそれぞれ,

$$Q_S = -W \int_0^L \left(1 - \frac{y}{L}\right) Q_n dy$$

$$Q_D = -W \int_0^L \frac{y}{L} Q_n dy$$

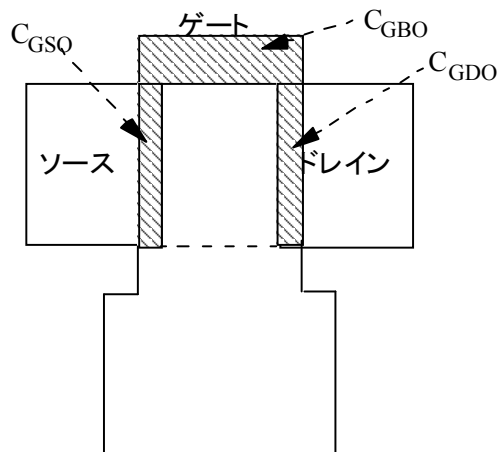
以上の関係式から各容量が導ける. 例えば,

$$C_{GS} = \frac{\delta Q_G}{\delta V_S} \quad C_{GB} = \frac{\delta Q_G}{\delta V_B}$$

28

SLIDE 28

オーバーラップ容量



チャンネル外容量のために**基本的には固定容量**。
フリンジング容量と分割不可能。

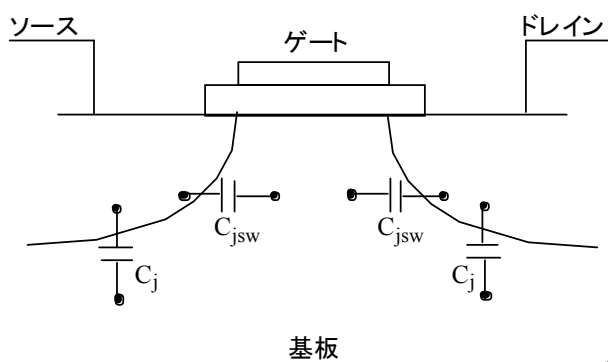
例えば線形領域 ($V_{GS} > V_{on} + V_{DS}$) では,

$$C_{GB} = C_{GBO} \cdot L$$

$$C_{GS} = C_0 \left\{ 1 - \left[\frac{V_{GS} - V_{DS} - V_{on}}{2(V_{GS} - V_{on}) - V_{DS}} \right]^2 \right\} + C_{GSO} \cdot W$$

$$C_{GD} = C_0 \left\{ 1 - \left[\frac{V_{GS} - V_{on}}{2(V_{GS} - V_{on}) - V_{DS}} \right]^2 \right\} + C_{GDO} \cdot W$$

接合容量

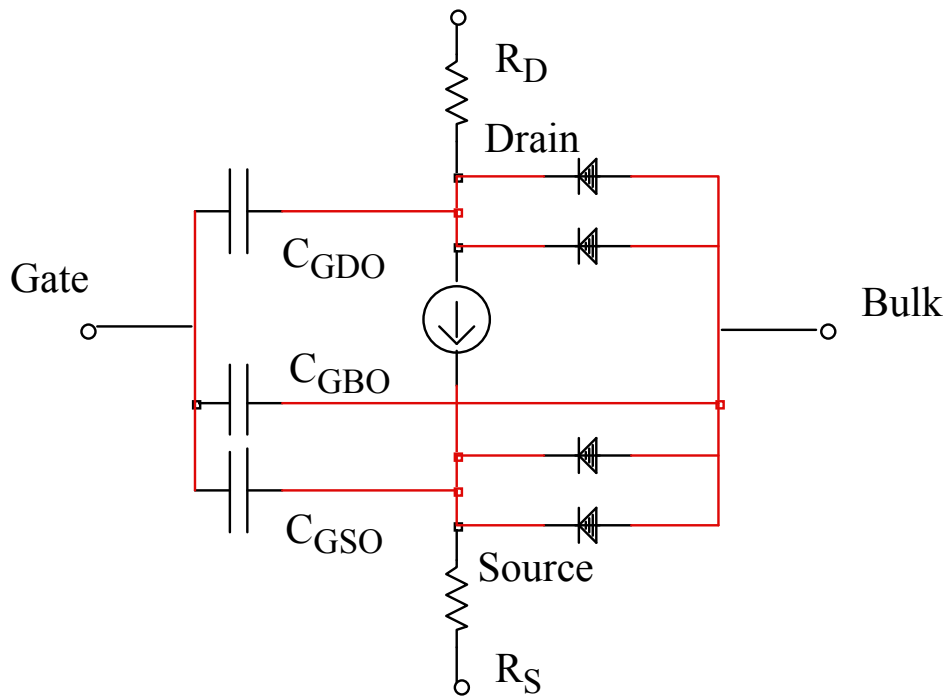


底部の面積容量と周囲長容量の和

$$C_{BS} = \frac{C_j \cdot A_S}{(1 - V_{BS} / P_B)^{M_j}} + \frac{C_{jsw} \cdot P_S}{(1 - V_{BS} / P_B)^{M_{jsw}}}$$

$$C_{BD} = \frac{C_j \cdot A_D}{(1 - V_{BD} / P_B)^{M_j}} + \frac{C_{jsw} \cdot P_D}{(1 - V_{BD} / P_B)^{M_{jsw}}}$$

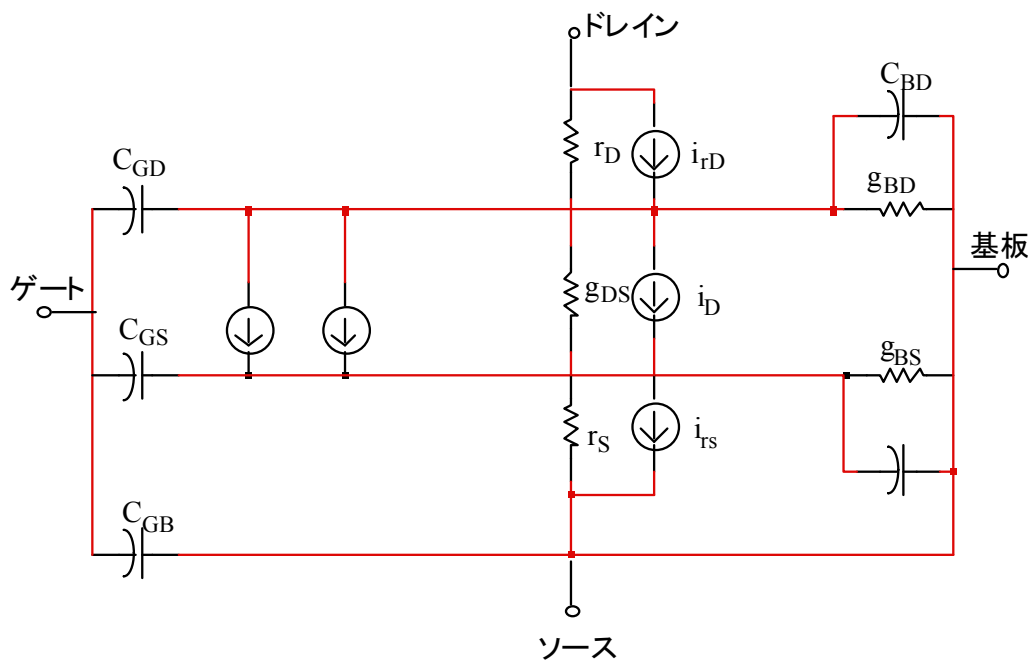
MOSFETの等価回路



31

SLIDE 31

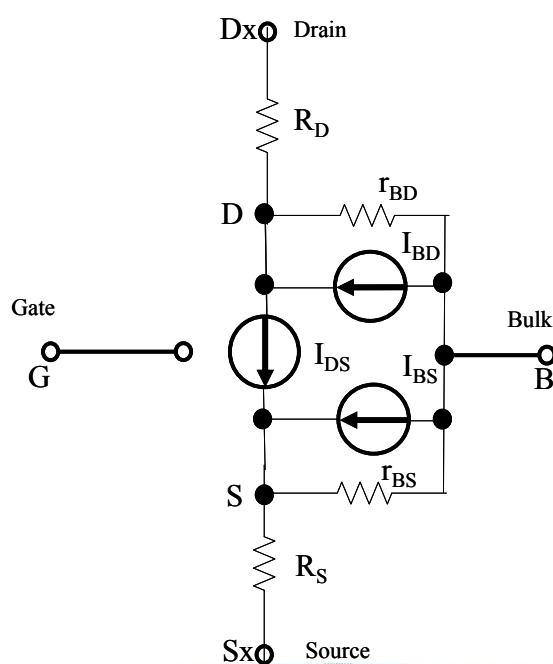
MOSFETのノイズ源モデル



32

SLIDE 32

- ここでは、簡単のため三端子MOSFETで考察
- 交流特性シミュレーションのための複素Y-Matrixを作成



ドレイン・ソース電流に関するマトリックス

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} D & G & S & B \end{matrix} \\ \begin{matrix} D \\ G \\ S \\ B \end{matrix} & \begin{bmatrix} D & G & S & B \\ g_{ds} & 0 & -g_{ds} & 0 \\ 0 & g_m & -g_m & 0 \\ -g_{ds} & -g_m & g_m + g_{mbs} + g_{ds} & -g_{mbs} \\ 0 & 0 & -g_{mbs} & g_{mbs} \end{bmatrix} \end{matrix} \begin{bmatrix} \\ \\ \\ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -I_{DS} \\ +I_{DS} \end{bmatrix}$$

35

SLIDE 35

接合ダイオードに関するマトリックス

$$\begin{bmatrix} g_{bd} & -g_{bd} \\ -g_{bd} & g_{bd} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} V_{BD+} \\ V_{BD-} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -I_{BD} \\ +I_{BD} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} g_{bs} & -g_{bs} \\ -g_{bs} & g_{bs} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} V_{BS+} \\ V_{BS-} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -I_{BS} \\ +I_{BS} \end{bmatrix}$$

36

SLIDE 36

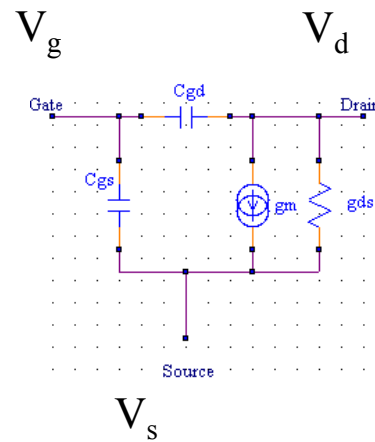
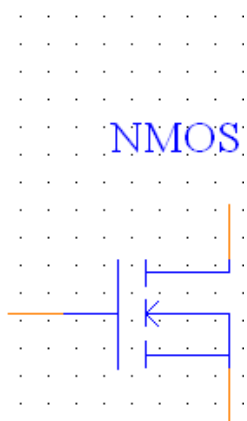
MOSFETの直流Yマトリックス

$$\begin{matrix}
 Dx \\
 Sx \\
 D \\
 G \\
 S \\
 B
 \end{matrix}
 \begin{bmatrix}
 Dx & Sx & D & G & S & B \\
 \frac{1}{R_D} & 0 & -\frac{1}{R_D} & 0 & 0 & 0 \\
 0 & \frac{1}{R_S} & 0 & 0 & -\frac{1}{R_S} & 0 \\
 -\frac{1}{R_D} & 0 & \frac{1}{R_D} + \frac{1}{r_{BD}} + g_{ds} & 0 & -g_m - g_{mbs} - g_{ds} & -\frac{1}{r_{BD}} - g_{bd} + g_{mbs} \\
 0 & 0 & 0 & g_m & -g_m & 0 \\
 0 & -\frac{1}{R_S} & -g_{ds} & -g_m & g_m + g_{mbs} + g_{ds} & -\frac{1}{r_{BS}} - g_{bs} - g_{mbs} \\
 0 & 0 & -\frac{1}{r_{BD}} - g_{bd} & 0 & -\frac{1}{r_{BS}} - g_{mbs} - g_{bs} & \frac{1}{r_{BD}} + \frac{1}{r_{BS}} + g_{mbs} + g_{bd} + g_{bs}
 \end{bmatrix}$$

37

SLIDE 37

MOSFETの交流等価回路



38

SLIDE 38

MOSFETの複素Y-Matrix?

$$\begin{array}{c} \text{Gate} \\ \text{Drain} \\ \text{Source} \end{array} \begin{array}{ccc} \text{Gate} & \text{Drain} & \text{Source} \\ \left[\begin{array}{ccc} ? & ? & ? \\ ? & ? & ? \\ ? & ? & ? \end{array} \right] & * & \left[\begin{array}{c} V_g \\ V_d \\ V_s \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} ? \\ ? \\ ? \end{array} \right]$$